

ALL. A

a) n. 1 assegno di durata annuale dell'importo di €19.367,00

Titolo della ricerca: "Equazioni differenziali alle derivate parziali non lineari" finanziato nell'ambito del progetto di ricerca MIUR progetto PRIN 2017JPCAPN

Sede di ricerca: Dipartimento di Matematica e Fisica;

Settore Scientifico Disciplinare: MAT/05 (Analisi Matematica);

Tutor: Prof. Giusi Vaira;

Data, ora e luogo del colloquio: 12/02/2020 ore 11:00, presso il Dipartimento di Matematica e Fisica, viale Lincoln, n.5, 81100 Caserta;

Oggetto del colloquio: Il colloquio verterà sull'attività di ricerca già svolta dal candidato e sulle tematiche di ricerca inerenti al progetto di ricerca.

b) n. 1 assegno di durata biennale dell'importo per anno di €19.367,00

Titolo della ricerca: "Ruolo delle perturbazioni acustiche sull'impacchettamento di sistemi granulari" finanziato nell'ambito del progetto di ricerca MIUR progetto PRIN 201798CZLJ

Sede di ricerca: Dipartimento di Matematica e Fisica;

Settore Scientifico Disciplinare: MAT/02;

Tutor: Prof. Eugenio Lippiello;

Data, ora e luogo del colloquio: 06/02/2020 ore 15:00, presso il Dipartimento di Matematica e Fisica, viale Lincoln, n.5, 81100 Caserta;

Oggetto del colloquio: Ensemble Statistici - Modelli di interazione tra grani – Software di dinamica molecolare.

c) n. 1 assegno di durata annuale dell'importo di €19.367,00

Titolo della ricerca: "Messa a punto della tecnica ED-XRF per l'analisi qualitativa e quantitativa puntuale e superficiale (MA-XRF) di elementi presenti in una matrice anche a bassissime concentrazioni" finanziato nell'ambito del finanziamento per attività di ricerca da parte della società INNOVA Scarl;

Sede di ricerca: Dipartimento di Matematica e Fisica;

Settore Scientifico Disciplinare: FIS/07 (Fisica Applicata);

Tutor: Prof. Carlo Sabbarese;

Data, ora e luogo del colloquio: 30/01/2020 ore 14:00, presso il Dipartimento di Matematica e Fisica, viale Lincoln, n.5, 81100 Caserta;

Oggetto del colloquio: Fluorescenza dei raggi X e tecnica ED-XRF. - Assorbimento ed attenuazione dei raggi X in uno o più strati diversi. Efficienza del metodo.- Risoluzione spaziale ed energetica.- Analisi spettrale.- Imaging MA-XRF. - Studio della distribuzione areale dei principali componenti dello strato superficiale del campione analizzato. - Riconoscimento di pigmenti. - Analisi statistica e fitting dei dati sperimentali.- Valutazione delle incertezze. - Software PYMCA per l'analisi spettrale e per studi di simulazione